

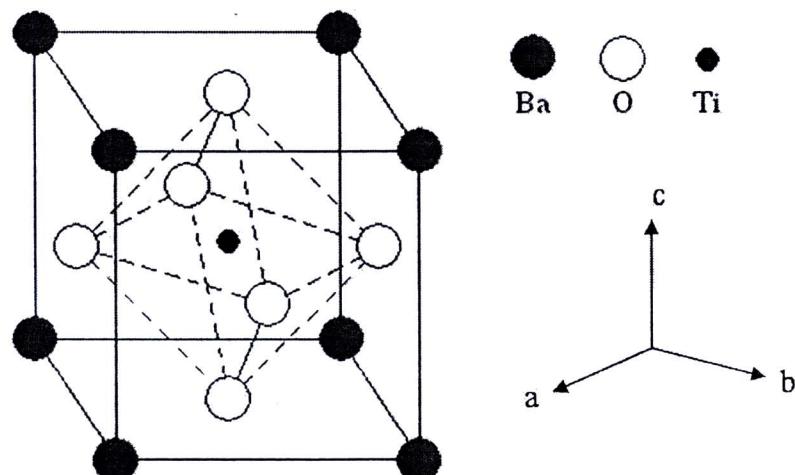
บทที่ 2

การทบทวนพฤษภ์ และเอกสารทางวิชาการ

2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของสารแบนเรียมไทดีบานเดต

หลังจากที่ Joseph Valasek [9] ได้รายงานผลการค้นพบปรากฏการณ์เฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectricity) ในผลึก Rochelle salt เมื่อปี ค.ศ. 1921 นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากก็ได้หันมาให้ความสนใจกับการศึกษาวิจัยผลึก Rochelle salt กันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลึก Rochelle salt สามารถถลายน้ำได้ง่ายและมีขนาดใหญ่มาก ทำให้มีข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน จนกระทั่งราวปี ค.ศ. 1940 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้มีการค้นพบสารเซรามิกชนิดที่สามารถแสดงสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกได้ดีเป็นตัวแรกนั่นก็คือ สารแบนเรียมไทดีบานเดต สูตร BaTiO_3 (BT) ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากของการสร้างสารเฟอร์โรอิเล็กทริก เนื่องจากกระบวนการเตรียมเซรามิกนั้นสามารถกระทำได้ง่ายกว่ากระบวนการปลูกผลึกมาก [10,11]

สาร BaTiO_3 มีโครงสร้างผลึกเหมือนกับโครงสร้างของแร่เพอเวอร์อฟสไกต์ (perovskite) CaTiO_3 โดยที่อุณหภูมิเหนือจุดครู่ (ประมาณ 120°C [4]) สาร BaTiO_3 จะมีเฟส (หรือ unit cell) เป็นแบบ cubic ที่มีการจัดเรียงของไอออนภายในโครงสร้างผลึกตามรูป 2.1

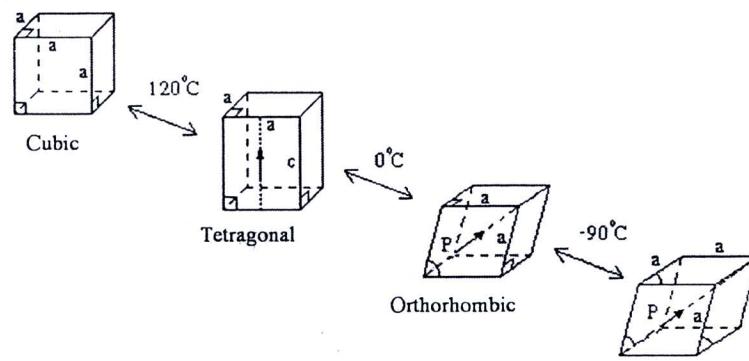


รูป 2.1 โครงสร้าง Perovskite ของสาร BaTiO_3 เฟส cubic [1]

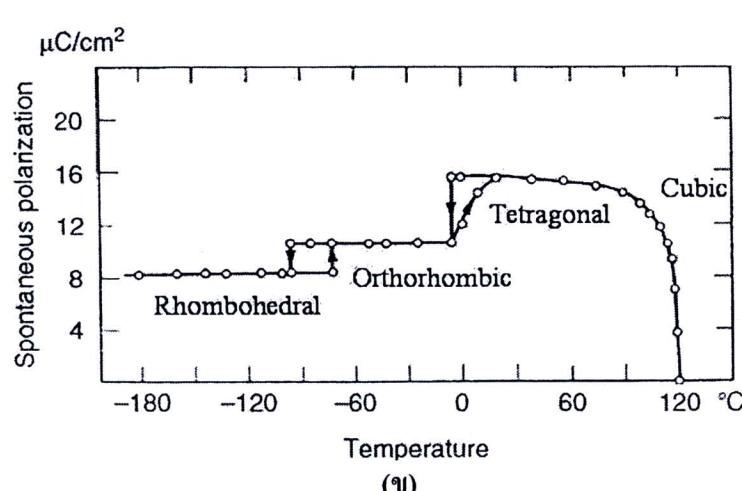
ส่วนโครงสร้างผลึกของสาร BaTiO_3 ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดคู่ริงมานั้น จะเกิดการบิดเบี้ยวไปจากรูป 2.1 ไปเป็นเฟส tetragonal โดยมีโอดemenตัวคูณเกิดขึ้นมาในทิศทางตามแนวแกน c จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงมาถึงที่อุณหภูมิประมาณ 0°C จึงเปลี่ยนจากเฟส tetragonal ไปเป็นเฟส orthorhombic และที่อุณหภูมิต่ำกว่า -90°C ก็จะเปลี่ยนจากเฟส orthorhombic ไปเป็นเฟส rhombohedral ตามลำดับ ดังแผนภาพแสดงในรูป 2.2 (ก) ซึ่งการเปลี่ยนเฟสของสาร BaTiO_3 ตามอุณหภูมิดังที่กล่าวมานี้จะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของค่า Spontaneous polarization และค่า Relative permittivity ดังแสดงในรูป 2.2 (ข) และ (ค) ตามลำดับ [5,12]

สำหรับวงวนชีสเทอร์ซิสของผลึกเชิงเดียว BaTiO_3 ที่มีเพียงโอดemenเดียว แสดงตามรูป 2.3(ก) ที่เกือบจะอยู่ในแนวตั้งนั้น เกิดจากการกระบวนการผันกลับของ spontaneous polarization โดยมีการก่อเกิดและเติบโตขึ้นของโอดemenแบบ 180° ในขณะที่วงวนส่วนที่วางตัวเกือบจะอยู่ในแนวอนั้นจะแสดงถึงสถานะอิ่มตัว ซึ่งผลึกจะมีเพียงโอดemenเดียว และมีค่า relative permittivity (ϵ_r) ในแนวเชิงข้าวประมาณ 160 (รูป 2.2(ค)) [13] เมื่อให้กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ 50 เฮิรตซ์ แก่ผลึกเชิงเดียว BT ทำให้วงวนที่เกิดนั้นมีค่า coercive field ที่อุณหภูมิห้องเป็น 0.1 เมกะโวลต์ต่อเมตร และมีค่า saturation polarization เท่ากับ 0.27 คูลอมบ์ต่อตารางเมตร และเมื่อให้สนามไฟฟ้าต่ำกว่า 0.1 เมกะโวลต์ต่อเมตร วงวนจะเกิดการหดตัวเล็กลง ซึ่งที่สนามไฟฟ้านาดประมาณ 1 โวลต์ต่อเมตร วงวนจะมีรูปร่างเป็นวงรีแคบ ๆ ที่มีแกนหลักขนาดใหญ่กับแนวของวงวนส่วนที่เกือบจะอยู่ในแนวอนัน [1]

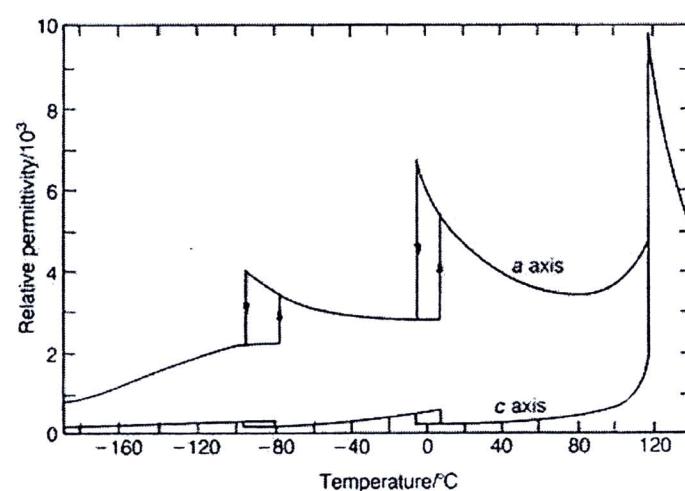
วงวนชีสเทอร์ซิสนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของสารเซรามิก แต่โดยปกติจะมีรูปร่างทั่ว ๆ ไปคล้ายคลึงกับที่แสดงไว้ในรูป 2.3(ข) เมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีของผลึกเชิงเดียวจะพบว่า วงวนชีสเทอร์ซิสของเซรามิกนั้นมีค่า coercive field สูงกว่า แต่ว่ามีค่า remanent polarization ต่ำกว่า ซึ่งในระหว่างรอบของวงวนนั้น วัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงของโอดemenทั้งในแบบ 90° และ 180° โดยอาจจะถูกบรรดาความบกพร่องและความเครียดที่เกิดขึ้นภายในผลึกมากหน่วยเอ้าไว้ด้วย [1]



(ก)

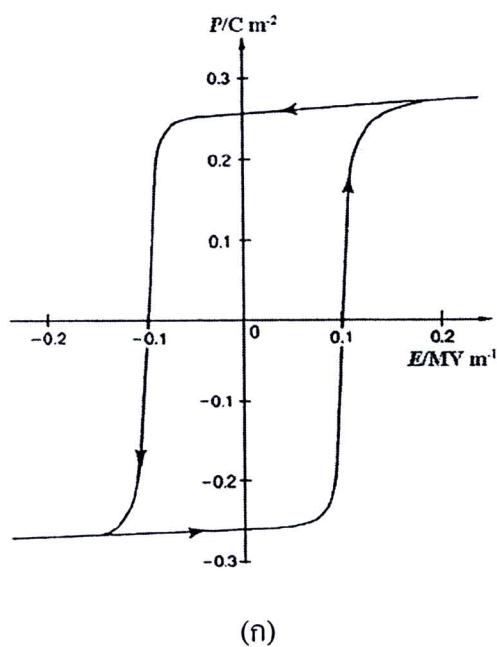


(ก)

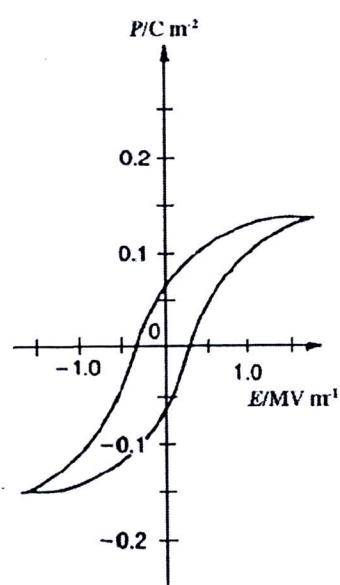


(ก)

รูป 2.2 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง : (ก) เฟส หรือ unit cell (ก) Spontaneous polarization และ (ค) ค่า Relative permittivity ที่วัดตามแนวแกน a และ c ของสาร BaTiO_3 ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ [5,13]



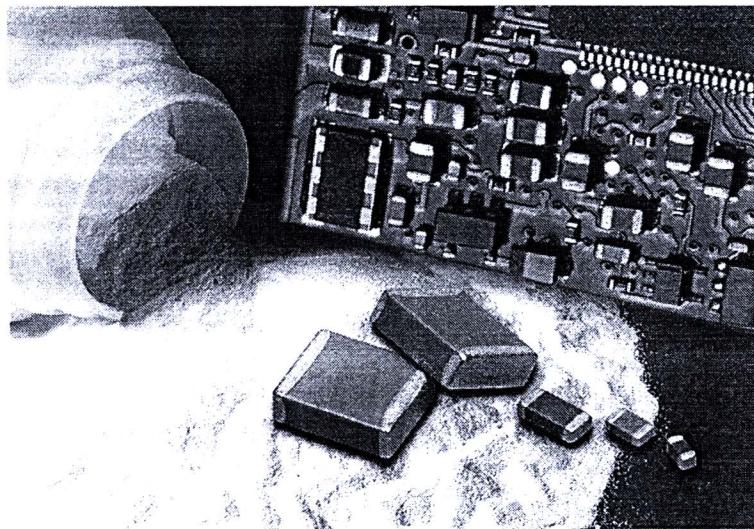
(n)



(u)

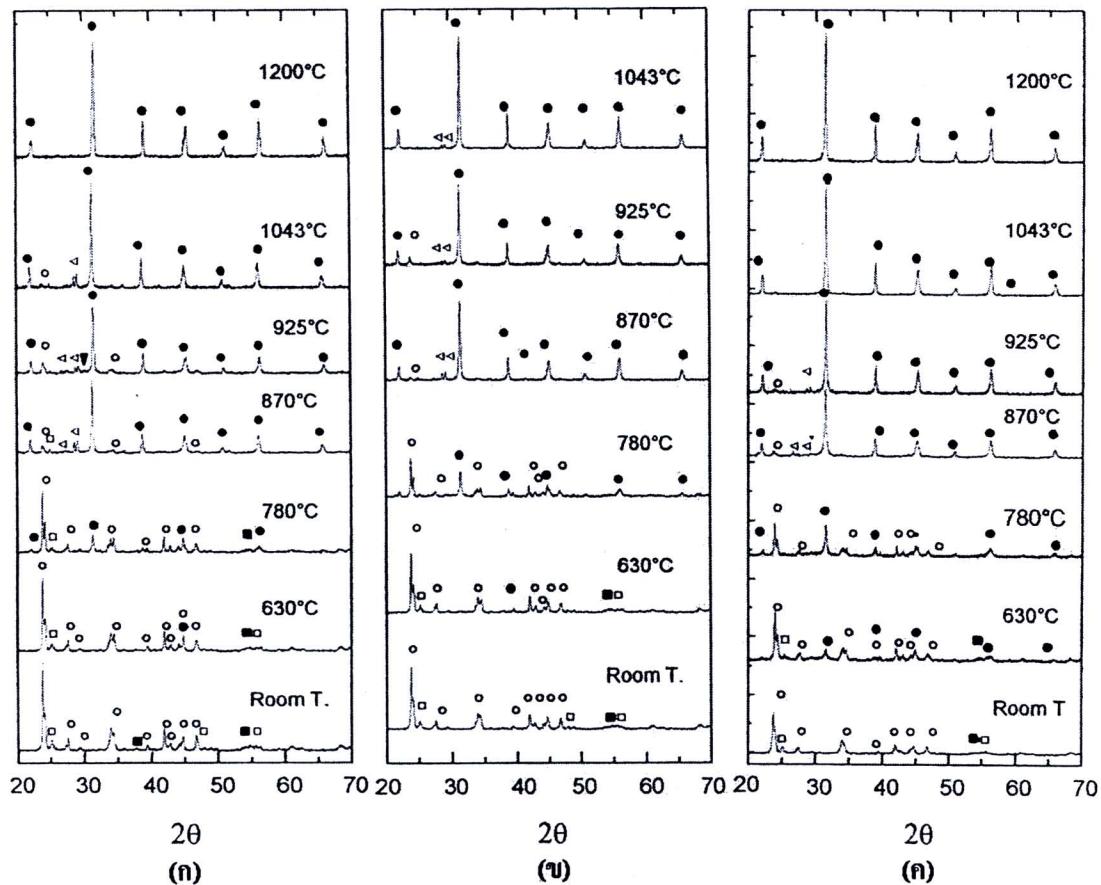
รูป 2.3 วงวนอิสเทอรีซิสของ (ก) พลีกเชิงเดียว BaTiO_3 ที่มีเพียงโดเมนเดียว และ (ข) เชรามิก BaTiO_3 ที่มีหลายโดเมน [14]

สาร BT เป็นสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง มีการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกต่ำ ($0.01-0.03$) และเป็นชนวนทางไฟฟ้า [15] มีรายงานว่า พลีกเดี่ยวของสารแบนเรียมไทเทเนตสามารถแสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิ 20°C ในทิศทางตามแนวการโพลประมวล 230 ส่วนในทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวการโพลมีค่าประมวล 4770 [1] สารเซรามิกแบนเรียมไทเทเนตซึ่งเป็นพลีกเดี่ยวที่มีการจัดวางตัวของไดโพลเป็นแบบสุ่มมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด (ที่อุณหภูมิคู่รี) ประมาณ 1740 แต่เมื่อให้สานามไฟฟ้าเข้าไปบ้างก็จะทำให้เซรามิกดังกล่าวมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดเพิ่มขึ้นมาอยู่ระหว่าง 2000-4500 ไดโดยทั่งนี้ก็ขึ้นกับกระบวนการเตรียมที่ใช้และตัวแปรสำคัญอื่น ๆ [1] ดังนั้น จึงนิยมนำสาร BT ไปประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาทิ ทรานสดิวเซอร์ (transducers) ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบหลายชั้น (multilayer capacitors) และเทอร์มิสเตอร์ (thermistors) [15-17] ดังตัวอย่างแสดงในรูป 2.4 สำหรับการสังเคราะห์สาร BT ให้ได้เฟสเพอรอฟสไกต์บริสุทธิ์นั้นสามารถทำได้ง่ายเมื่อเทียบเคียงกับการสังเคราะห์สารเฟอร์โรอิเล็กทริกในกลุ่มที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น สาร酳เซอร์โโคเนต ไทเทเนต $\text{Pb}(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_x)\text{O}_3$ (PZT) เลดแมกนีเซียมไนโตรเจน ไนโตรเจน $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (PMN) หรือเลดซิงค์ไนโตรเจน $\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (PZN) [1] และยังสามารถทำการสังเคราะห์สาร BT ได้หลากหลายวิธี เช่น มิกซ์ออกไซด์ การตกตะกอน และโซล-เจล เป็นต้น [5,18-20] ซึ่งแต่ละวิธินั้นก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การเตรียมสาร BT ให้มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณลักษณะตามที่ต้องการนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเตรียมสาร และเงื่อนไขที่เลือกใช้เป็นสำคัญ ดังเช่นในงานวิจัยของ Brzozowski และ Castro [18] ที่ได้รายงานผลการทดลองศึกษาอิทธิพลของการเตรียมสาร BaTiO_3 ด้วยเทคนิค mixed oxide โดยการใช้สารตั้งต้น BaCO_3 และ TiO_2 เมื่อถูกแต่ใช้วิธีการบดอย่างด้วยเทคนิค Ball-milling เปรียบเทียบกับเทคนิค Planetary-milling แล้วจึงนำสารผสมที่ผ่านการบดอย่างด้วยแต่ละเทคนิคไปเผาแคลไซซ์ในช่วงอุณหภูมิประมวล $600\text{-}1200^{\circ}\text{C}$ จากนั้นจึงนำไปทำการตรวจสอบเฟสที่เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคนิค X-ray diffraction พบว่าได้ผลดังรูป 2.5



รูป 2.4 ตัวอย่าง Applications ของสาร BaTiO_3 [1]

ซึ่งจากผลการทดลองของ Brzozowski และ Castro [18] จะเห็นได้ว่าในการเตรียมสาร BT นั้นถึงแม้ว่าจะใช้สารตั้งต้นเหมือนกัน แต่เลือกใช้กรรมวิธีในการบดย่อยที่แตกต่างกัน หรือใช้ระยะเวลาในการบดย่อยนานต่างกัน ล้วนแต่สามารถส่งผลต่อปริมาณการเกิดเฟสเพอร์อฟส์ไกต์ของสาร BT ได้ทั้งสิ้น นอกจากอิทธิพลของกรรมวิธีที่เลือกใช้ในการเตรียมสาร BT แล้ว ก็ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของระยะเวลาในการบดย่อยสาร BT ที่ส่งผลต่องานดองุภาคและปริมาณการเกิดเฟสของสาร BT ได้เหมือนกัน ดังเช่นในตัวอย่างผลการวิจัยของ Chaisan [5] และคณะ ที่ได้ทำการบดย่อยอนุภาคของ BT ให้มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรด้วยเทคนิค vibro-milling โดยใช้เงื่อนไขของระยะเวลาในการบดย่อย ดังแสดงในตาราง 2.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อใช้เวลาในการบดย่อยนานขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเผาแคล ใช้น้ำให้สาร BT เฟสบริสุทธิ์และขนาดอนุภาคจะลดลง



รูป 2.5 X-ray diffraction patterns ของผงแบบเรียมไทเทเนตที่เตรียมโดยวิธี (ก) Ball milling นาน 2 ชั่วโมง, กับวิธี Planetary milling นาน (ง) 2 ชั่วโมง และ (ค) 10 ชั่วโมง โดย ○ แทนเฟส ของ BaCO_3 , □ : TiO_2 (anatase), ■ : TiO_2 (rutile), ● : BaTiO_3 , ▲ : Ba_2TiO_4 , ▼ : BaTi_2O_5

[18]

ตาราง 2.1 แสดงอิทธิพลของเวลาในการบดย่อยต่ออุณหภูมิแกลไชน์ และขนาดอนุภาคของ BaTiO₃ ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน [5]

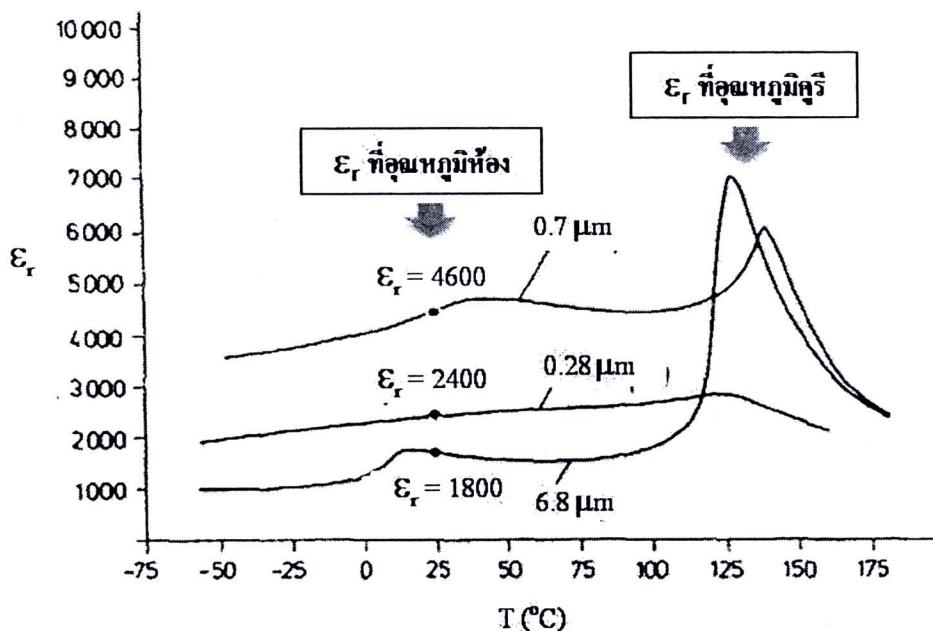
Milling time (h)	Required calcination temperature (°C)	ขนาดอนุภาคที่วัดได้จาก	
		เทคนิค XRD (nm)	เทคนิค SEM (nm)
0.5	1300	38.32	250-1400
10	1250	32.09	100-500
15	1250	32.38	100-1000
20	1250	31.95	250-700
25	1200	31.60	250-700
30	1200	31.56	100-400

การจะทำให้สาร BT เกิดเป็นเฟสเพอรอฟไกต์ที่มีบริสุทธิ์สูงได้นั้น สามารถทำได้โดยการ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเตรียมสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้มาซึ่งสารเซรามิกที่มี ความหนาแน่นในระหว่างกระบวนการเผาชินเตอร์ และค่าความหนาแน่นของสารเซรามิกนั้นเองที่ มีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมทางไฟฟ้าของสาร รวมถึงสมบัติไดอิเล็กทริก เป็นที่ทราบกัน โดยทั่วไปว่าสมบัติไดอิเล็กทริกของสารเซรามิก BT นั้นมีการตอบสนองต่อนาคเกรนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเซรามิก BT มีเกรนขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร จะมีค่า relative permittivity ที่อุณหภูมิห้องสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างขุลภาคกับค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ϵ_r) ของเซรามิก BT อยู่เป็นจำนวนมาก [19,20] โดยที่ ส่วนใหญ่พบว่า สารเซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนในช่วงประมาณ 20-50 ไมโครเมตร จะแสดงค่า ϵ_r ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1500 – 2000 [21] ในขณะที่เซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนเล็กลงมาอยู่ในช่วง ประมาณ 0.8-1 ไมโครเมตร จะให้ค่า ϵ_r สูงสุดได้สูงถึงประมาณ 5000 [22,23] แต่ทว่าในกรณีของ เซรามิก BT ที่มีขนาดน้อยกว่า 0.8 ไมโครเมตร กลับให้ค่า ϵ_r ที่ลดต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ 4500-4600 [24-26] เป็นด้าน ดังเช่น ตัวอย่างงานวิจัยของ Kinoshita และ Yamaji [25] ที่ได้ทำการศึกษาอิทธิพล ของขนาดเกรนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดในสารเซรามิก BT แล้วพบความสัมพันธ์ ดังแสดงใน ตาราง 2.2 เป็นดัง

ในปีค.ศ. 1985 Arlt และคณะ [24] ได้ทำการศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนแตกต่างกัน 3 ช่วง ดังแสดงในรูป 2.6 โดยเมื่อพิจารณาที่ค่าอุณหภูมิห้อง พบว่า เซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนอยู่ในช่วงประมาณ 0.7 ไมโครเมตร มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงกว่าสารเซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนประมาณ 0.28 และ 6.8 ไมโครเมตร ในขณะที่ ถ้าพิจารณาจากค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ อุณหภูมิคู่รี พบว่า สารเซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนใหญ่ประมาณ 6.8 ไมโครเมตร สามารถแสดง ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด ได้สูงโดยเด่นกว่าในทุกรายงานที่ได้ทำการศึกษา โดยเซรามิกที่มีขนาด ประมาณ 0.28 ไมโครเมตร มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดน้อยกว่าทุกรายงาน จากนั้นในปีค.ศ. 2007 Ying และ Hsieh [27] ได้ศึกษาพฤติกรรมการเผาชินเตอร์ รวมไปถึงสมบัติไดอิเล็กทริกของสาร เซรามิก BT ที่มีโครงสร้างผลึกในระดับนาโนเมตร โดยเตรียมผง BT จากเทคนิคทางเคมี (chemical dispersion) และทางกายภาพ (grinding/mixing) รวมกัน พบว่า หากเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลานาน 6 ชั่วโมง จะได้ค่าไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้องดีที่สุด ($\epsilon_r = 8000$; $\tan\delta = 5 \times 10^{-3}$) ดัง แสดงในรูป 2.7

ตาราง 2.2 อิทธิพลของขนาดเกรนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด ($\epsilon_{r(\max)}$) และอุณหภูมิคู่รี (T_c) ของ สารเซรามิก BT ที่มีขนาดเกรนเฉลี่ยค่าต่าง ๆ [25]

ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)	$\epsilon_{r(\max)}$ (1 kHz)	T_c ($^{\circ}\text{C}$)
53	10750	122
13	10910	122
3.0	10580	121
2.2	12830	121
1.5	13150	121
1.1	10780	120



รูป 2.6 แสดงพฤติกรรมของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 1 kHz ของสารเซรามิก BaTiO_3 ที่มีขนาดเกรนแตกต่างกัน 3 ช่วง [24]

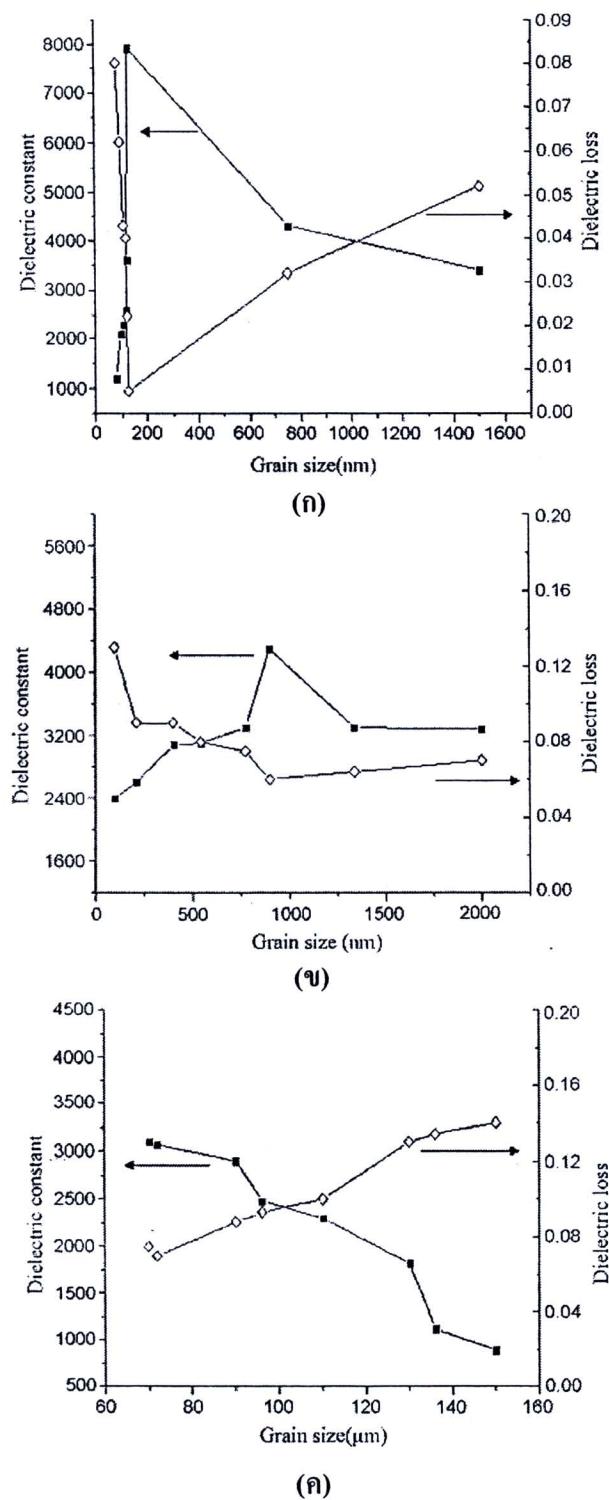
นอกจากนี้ ในปีค.ศ. 1997 ยังได้มีการศึกษาสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของสาร BT ที่อยู่ในรูปของฟิล์มบาง โดย Sharma และ Mansingh [28] ซึ่งใช้เทคนิค sol-gel ในการเตรียมฟิล์มบาง BT แล้ววัดค่า P-E loop เปรียบเทียบกับสาร BT ที่อยู่ในรูปของผลึกเดียว และเซรามิก ดังแสดงในตาราง 2.3 พบว่า สาร BT ที่อยู่ในรูปของฟิล์มบางนั้นจะมีค่า Remanent polarization (P_r) และ Spontaneous polarization (P_s) ที่ต่ำกว่าสาร BT ที่อยู่ในรูปผลึกเดียว และเซรามิก แต่ค่า Coercive field (E_c) ที่ได้กลับมีค่าสูงกว่า



ตาราง 2.3 แสดงสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของสาร BT ในรูปของเซรามิกและฟิล์มบาง

Samples	Remanent polarization $P_r (\mu\text{C cm}^{-2})$	Spontaneous polarization $P_s (\mu\text{C cm}^{-2})$	Coercive field $P_r (\mu\text{C cm}^{-2})$	References
Single crystal	20.0	25.0	10	[29]
Ceramic (sol-gel)	12.6	19.0	30	[30]
Thin film (sol-gel)	3.2	14.0	53	[28]

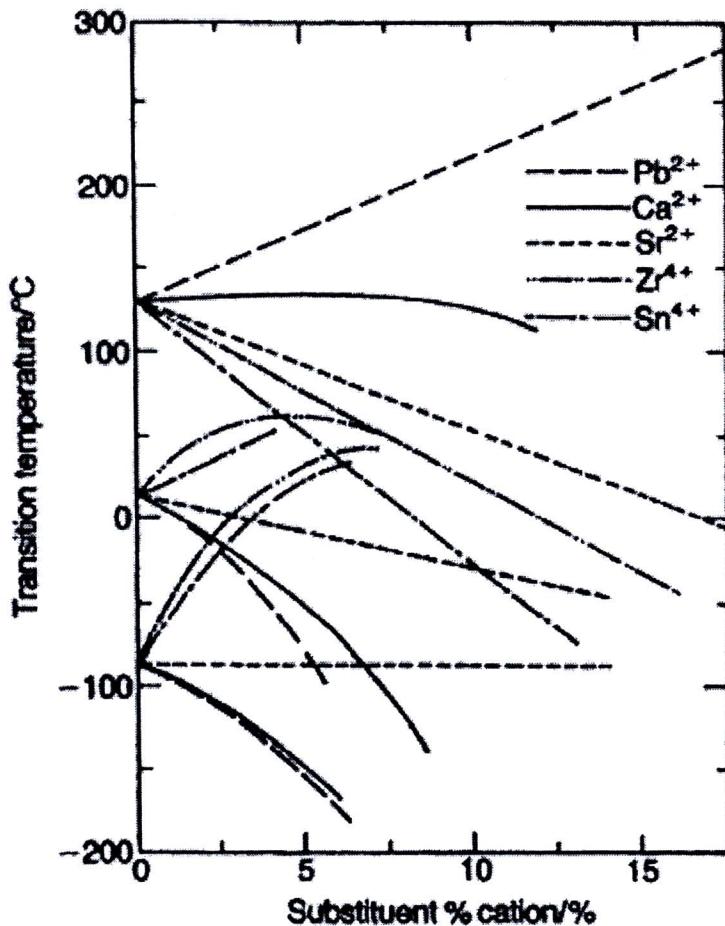




รูป 2.7 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 1 kHz ของสารเซรามิก BaTiO₃ ที่มีขนาดเกรนแตกต่างกัน เผาชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (ก) 1100 (ข) 1200 และ (ค) 1300 °C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง [27]

2.2 ข้อมูลของสารเซรามิกแบบเรียนไทยแทนดัชนิดที่เจือด้วยเหล็กและไนโตรบีอิม

มีข้อมูลจากการวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการเติมสารชนิดต่าง ๆ (หรือแคตไอออน) เจือลงไปในสาร BaTiO_3 นั้น ทั้งชนิดและปริมาณความเข้มข้นของสารที่เจือสามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางไดอิเล็กทริกของสารได้ เช่น ค่าอุณหภูมิคู่รี อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (transition temperature) รวมถึงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี [1] ดังเช่นตัวอย่างแสดงในรูป 2.8 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของสาร BT อยู่ 3 ชุด หลังจากที่มีการเจือแคตไอออนชนิดต่าง ๆ ลงไป โดยในชุดแรกนั้นเมื่อเป็นสาร BT บริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสจาก cubic ไปเป็น tetragonal ประมาณ $120\text{-}130^\circ\text{C}$ แต่เมื่อเจือสารเข้าไปแทนที่ Ba^{2+} ในตำแหน่ง A-site ทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสเกิดได้ 2 แบบ คือ อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสจะสูงขึ้นเมื่อเจือ Pb^{2+} ซึ่งมีขนาดอะตอมที่ใหญ่กว่า Ba^{2+} ลงไปจะทำให้สาร BT มีอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสสูงขึ้น แต่เมื่อเจือ Ca^{2+} และ Sr^{2+} ที่มีขนาดอะตอมเล็กกว่า Ba^{2+} ลงไปพบว่า อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสลดลงเมื่อปริมาณสารเจือสูงขึ้น ซึ่งการที่อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของสาร BT เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากการย้ายระหว่างอะตอม (displacement) แตกต่างกันนั่นเอง และถ้าหากเจือสารเข้าบางชนิดไปแทนที่ Ti^{4+} ในตำแหน่ง B-site เช่น Zr^{4+} หรือ Sn^{4+} จะส่งผลทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของ BT ลดลงเมื่อปริมาณของสารเจือเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ที่จุดเปลี่ยนเฟสจาก tetragonal ไปเป็น rhombohedral (ชุด 2) และ rhombohedral ไปเป็น orthorhombic (ชุด 3) นั้นเมื่อเติมสารเจือ เช่น Pb^{2+} และ Ca^{2+} ไปแทน Ba^{2+} ในสาร BT จะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนเฟสลดลง ส่วนการเติมสารเจือ Zr^{4+} หรือ Sn^{4+} ไปแทน Ti^{4+} จะทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของสาร BT สูงขึ้นเนื่องมาจากโครงสร้างของสาร BT เกิดการบิดเบี้ยวโดยมีแกนเชิงขั้วนาโนไปกันแนวเส้นทแยงมุมที่ผิวน้ำ (rhombohedral) และแกนเชิงขั้ววางแผนตามแนวทแยงมุมผ่านกลางเซลล์หน่วย (orthorhombic) ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสเกิดการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของสารเจือที่เติมไป แต่จะสังเกตเห็นว่าที่จุดเปลี่ยนเฟสจาก rhombohedral ไปเป็น orthorhombic นั้น Sr^{2+} ที่เจือลงไปนั้นไม่มีผลต่ออุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของสาร BT [31] ดังเช่นในงานวิจัยของ Ihrig และคณะ [32] ปี 1978 ได้ศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของสาร BT ด้วยการเจือสาร Ga^{3+} และ Zn^{2+} ลงไปพบว่า charge defect ทำให้เกิดໄโคโพลโมเมนต์ขึ้นภายในชิ้นงาน ส่งผลให้อุณหภูมิคู่รีของสาร BT ลดลง เนื่องจากสารที่เจือลงไปทำให้ช่องว่างระหว่างออกซิเจนที่อยู่ในรูป octahedron บิดเบี้ยว แล้วเกิดการจัดเรียงตัวใหม่อยู่ในรูป cubic



รูป 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟสกับความเข้มข้นของแคตไอออนชนิดต่างๆ ที่เจือลงไประบบ BaTiO₃ [31]

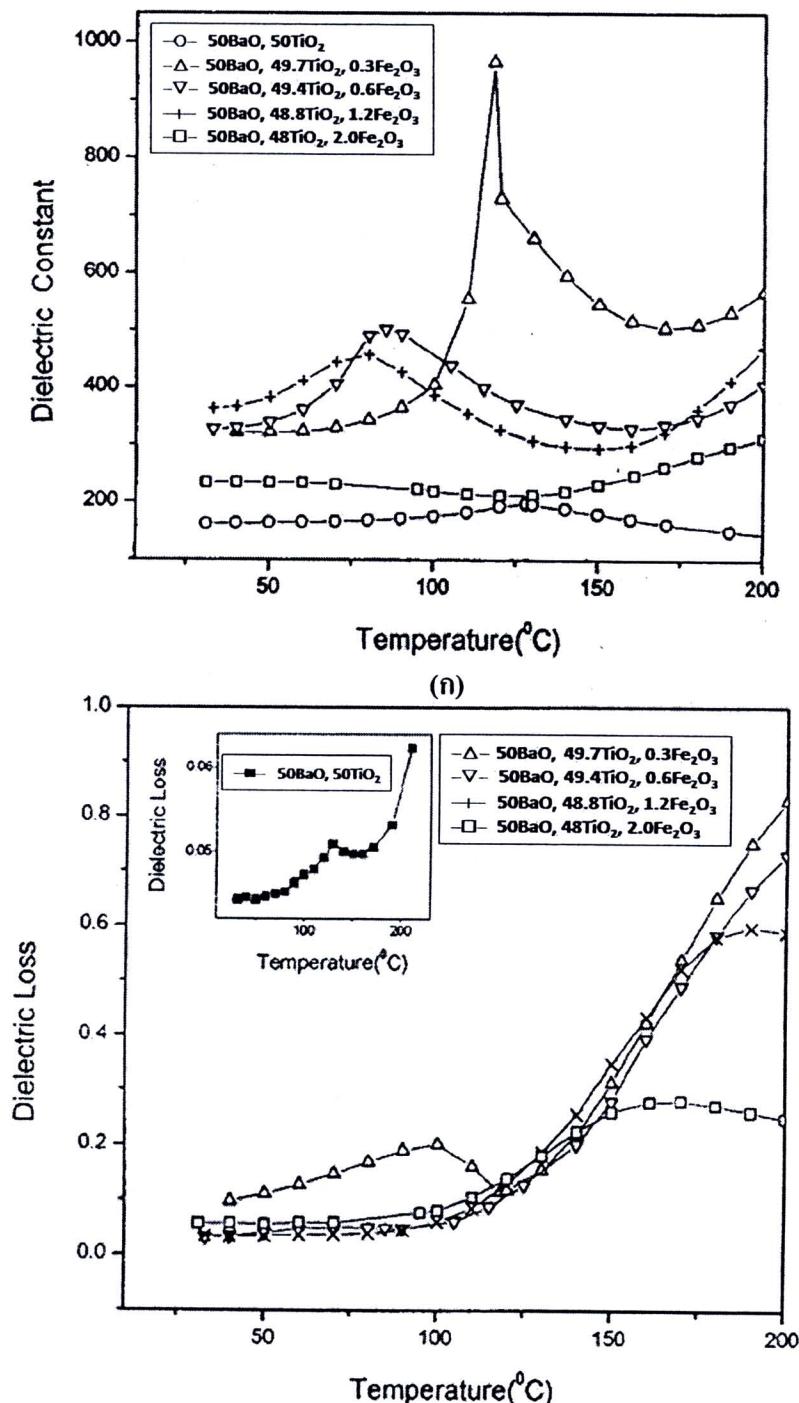
ประโยชน์ของการเจือ (doping) สารเข้าไปใน BT นั้นก็เพื่อที่จะปรับปรุงสมบัติได้อีกทrikให้มีความเหมาะสมกับการนำไประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น การเจือสารที่เป็นตัวรับ (acceptor dopants) ในกลุ่ม Fe³⁺, Co³⁺ หรือ Mn³⁺ ให้เข้าไปแทนที่ของ Ti⁴⁺ ในสาร BT จะนำไปสู่กลไกการหน่วงการเคลื่อนที่ของ domain wall ที่ส่งผลทำให้สารมีค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกลดลงได้ หรือในการผิวของการเจือสารที่เป็นตัวให้ (donor doping) ในกลุ่ม Nb⁵⁺ เข้าไปแทนที่ของ Ti⁴⁺ ในสาร BT พนว่าจะนำไปสู่กลไกการยับยั้งการโตของเกรน ที่ส่งผลทำให้สารมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงขึ้นได้ [1] ดังที่ได้มีรายงานในปี 2005 โดย Jana และคณะ [33] พนว่า การเจือเหล็กด้วยปริมาณที่แตกต่างกันใน BT ที่มีอนุภาคขนาดนาโนเมตรนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเฟสจากเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นพาราอิเล็กทริกแตกต่างกัน และนอกจากนั้นก็พบว่า หากเจือเหล็กในปริมาณร้อยละ 0.3 โดยโนล ทำให้ค่าไดอิเล็กทริกสูงสุด ดังแสดงในรูป 2.9 นอกจากนั้น ก็มีรายงาน

ผลการวิจัยของ Abdelkafi และคณะ [34] ที่ได้ทำการทดลองเติมทั้งสารที่เป็นตัวรับ (Fe^{3+}) และตัวให้ (Nb^{5+}) ลงไปแทน Ti^{4+} ในสาร BT โดยพบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพล็อกจาก tetragonal ไปเป็นเฟส cubic เมื่อเพิ่มปริมาณของ $\text{Fe}^{3+}/\text{Nb}^{5+}$ ให้มากพอ ดังแสดงในตาราง 2.4 นอกจากนี้ยังพบว่า การเติมเหล็กและไนโอลีบิเมียนในสาร BT นั้นสามารถส่งผลทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของสารปรับเปลี่ยนได้ และยังสามารถทำให้สาร BT ซึ่งเดิมมีพฤติกรรมแบบ normal ferroelectric และคงพฤติกรรมแบบ relaxor ferroelectric ได้อีกด้วย

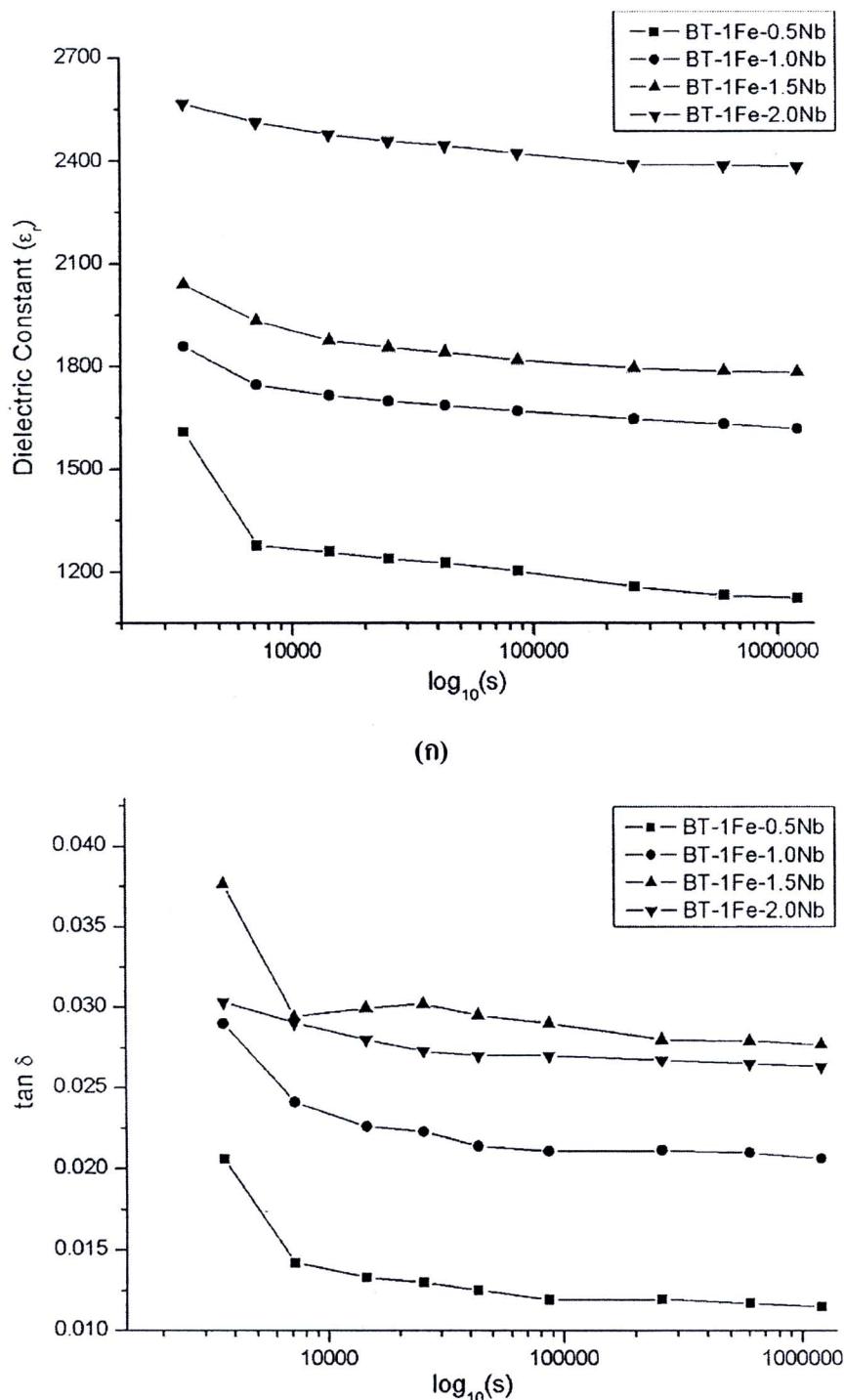
ในปี ค.ศ.2009 Prasertpalichatr และคณะ [35] ได้ศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมตามอายุของสมบัติโคอิเล็กทริก และสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของเซรามิกแบบเรียมไหเทเนตที่มีการเจือด้วยเหล็ก และไนโอลีบิเมียน สูตร $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.99-x}\text{Fe}_{0.01}\text{Nb}_x)\text{O}_3$ ที่มีค่า $x = 0.005-0.020$ โดยพบว่า เซรามิก BT ที่มีการเจือด้วยไนโอลีบิเมียนในปริมาณที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเสื่อมตามอายุของค่าคงที่ โคอิเล็กทริก และค่าความสูญเสีย โคอิเล็กทริกลดลงแบบช้าๆ ไปจนเชื่ลกันเวลา ส่วนการเสื่อมอายุของวงวนอิสเทอร์เชิสจะประมาณ 400 ชั่วโมง น้อยกว่าหรือเท่ากับ ความเข้มข้นของ Fe^{3+} ดังแสดงในรูปที่ 2.10 และ 2.11 เป็นที่น่าสังเกตว่า ยังไม่มีการรายงานผลการศึกษาถึงอิทธิพลของสารเจือ Fe_2O_3 และ Nb_2O_5 ที่มีต่อเฟสและโครงสร้างจุลภาคของสารเซรามิก BT ชนิดที่เตรียมขึ้นมาจากการเจือ BT ที่มีขนาดอนุภาคนาโนเมตรมาก่อน ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นที่สองทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำสารเซรามิกที่ได้จากการศึกษาในประเด็นแรกมาทำการศึกษาวิจัยถึงอิทธิพลของสารเจือ Fe_2O_3 และ Nb_2O_5 ต่อไป

ตาราง 2.4 อิทธิพลของสารเจือเหล็ก/ไนโอลีบิเมียน ที่มีต่อโครงสร้างพล็อกและค่าแอลตราแม่เหล็กของสารเซรามิกในระบบ $\text{BaTi}_{1-x}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})_x\text{O}_3$ [34]

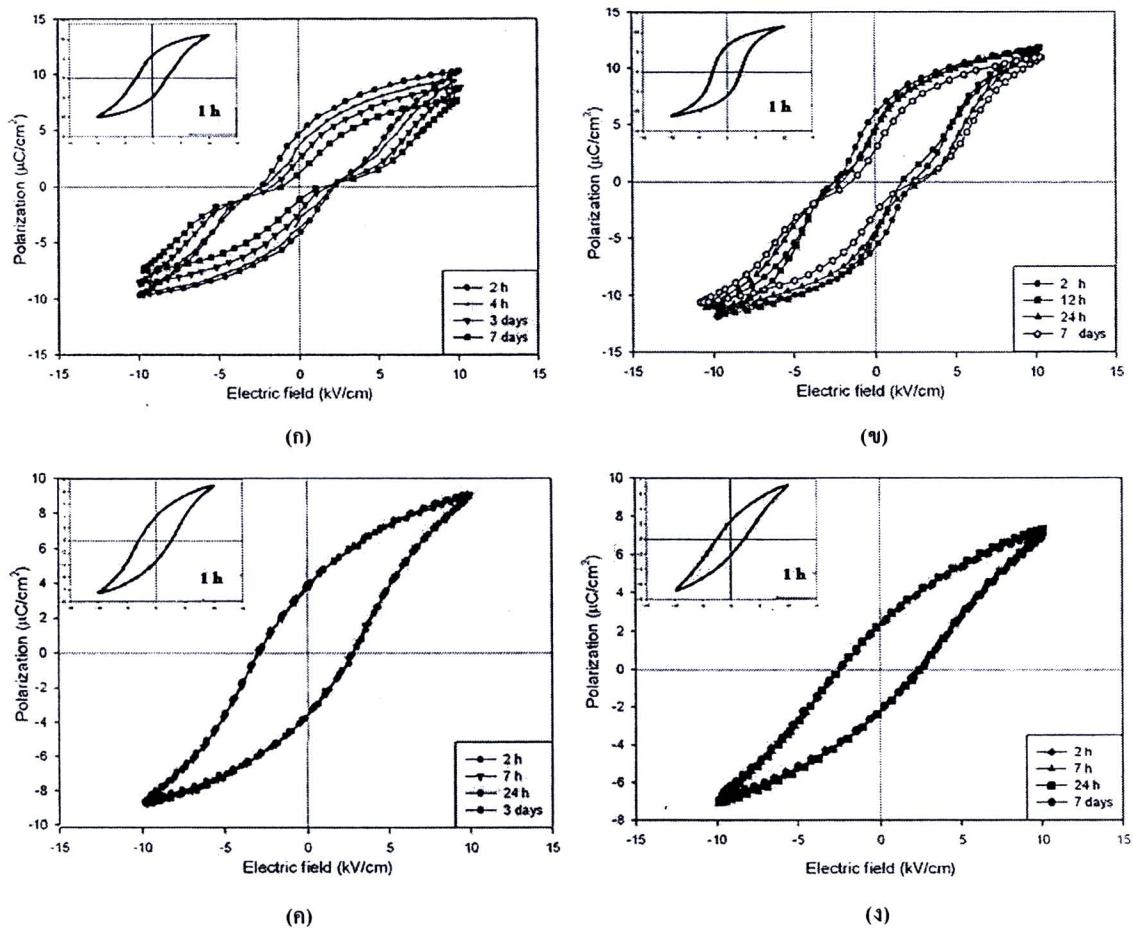
Composition (x)	Structure	a (Å)	c (Å)	c/a
0.025	Tetragonal	4.0006 (8)	4.0230 (6)	1.00559
0.050	Tetragonal	4.0064 (9)	4.0138 (2)	1.00183
0.075	Cubic	4.0098 (4)		
0.100	Cubic	4.0106 (1)		
0.125	Cubic	4.0119 (5)		
0.150	Cubic	4.0129 (1)		



รูป 2.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง (ก) ϵ_r และ (ข) ค่าการสูญเสียทางไคโอดิเล็กทริก กับอุณหภูมิ ของสารเซรามิก BT ที่มีการเพิ่มสาร Fe_2O_3 ในปริมาณต่าง ๆ กัน (ที่ 10 kHz) [33]



รูปที่ 2.10 การเสื่อมตามอายุของ (ก) ค่าคงที่ทางไดโอลีคทริก (ข) ค่าความสูญเสียไดโอลีคทริกในเซรามิก $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.99-x}\text{Fe}_{0.01}\text{Nb}_x)\text{O}_3$ เมื่อ $x = 0.005-0.020$ [35]



รูปที่ 2.11 การเดือนตามอายุของวัสดุชิสเทอร์เชิสในเซรามิก $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.99-x}\text{Fe}_{0.01}\text{Nb}_x)\text{O}_3$ เมื่อ
 (ก) $x = 0.005$, (บ) $x = 0.010$, (ค) $x = 0.015$ และ (ง) $x = 0.020$ (วัดที่ความถี่ 50 Hz และ
 25 °C) [35]